

卓上自動粒子解析SEM/EDS

Phenom ParticleX

アメリカ サーモフィッシャーサイエンティフィック社製

thermo
scientific

全自動粒子解析が可能な
「粒子を測る」ためのシステム



仕様

電子銃	: CeB ₆
倍率	: 160 ~ 200,000 倍
光学ナビゲーション	: カラー、3 ~ 16 倍
反射電子検出器	: 標準搭載
二次電子検出器	: オプション
元素分析機能	: 標準搭載

Particles 究極の全自動粒子解析システム

粒子を捉える
「高画質」

クリアな粒子像を
自動粒子解析で実現

数千~数万個の
粒子を解析する
「スピード」

良質なデータを
1秒1粒子で取得

品質管理を支える
「再現性」

最高クラスの
繰り返し精度・再現性

粒子の検出から、サイズ・形状計測、元素分析、分類までを完全自動化！

高輝度・長寿命のCeB₆電子銃、大きな試料室を搭載し、清浄度検査や粒子の評価を全自動で行うことが可能です。

さらに、通常のSEMとして多彩な観察・解析にも対応し、1台で品質管理の現場から研究開発まで多様なニーズに威力を発揮します。

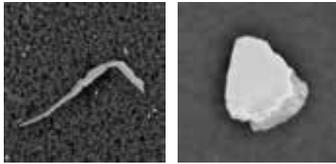
- CeB₆電子銃による安定した測定が可能
- 検出～分類まで1粒子1秒、短時間で解析可能
- 測定レシピやレポートは自由自在にカスタマイズ可能



用途に応じて5つのモデル

Phenom ParticleX TC 自動清浄度検査

製造部品清浄度検査や製造工程における異物源の特定



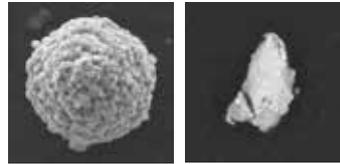
アルミニウム片 Si 粒子

- ・規格に準拠したレポート作成が可能
ISO16232 / VDA19
ISO4406/7



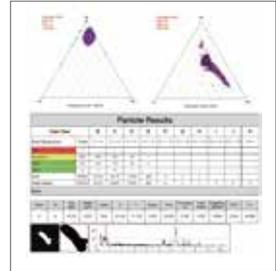
Phenom ParticleX Battery 電池材料の品質管理

電池の製造工程における異物源の特定や電池材料の品質管理



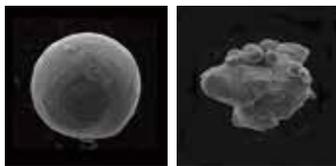
正極材料 (NCM) 異物粒子

- ・三元系ダイアグラム等による結果の表示が可能
- ・粒子の種類、サイズ、導電性に基づいて分類することが可能



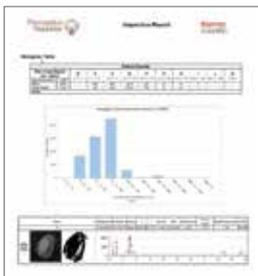
Phenom ParticleX AM 粒子材料の特性評価

アディティブマニュファクチャリングの原料粉末の検査



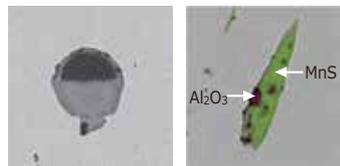
原料粒子 (新粉) 原料粒子 (再利用粉)

- ・レポートは任意にカスタマイズ可能



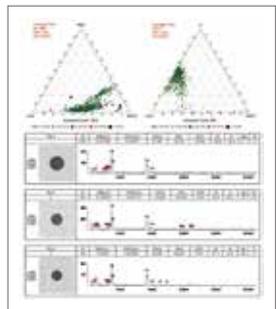
Phenom ParticleX Steel 鉄鋼中の介在物の評価

鋼材中の介在物のサイズ・形状情報、組成情報を短時間で取得



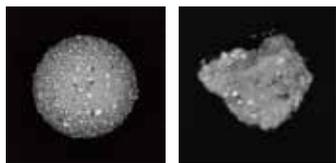
介在物の SEM 像 介在物の EDS マッピング像

- ・三元相ダイアグラムによる結果表示が可能
- ・レポートは任意にカスタマイズ可能



Phenom Perception GSR 射撃残渣の自動分析

射撃残渣 (GSR) の自動分析に特化したシステム



GSR 粒子 GSR 粒子

- ・GSR 粒子の特定、分類、検証、レポート作成を行うことが可能
- ・ASTM E1588-17 に準拠
- ・Pb フリーのタイプにも対応



Phenom ParticleXのウェビナーの録画

左のQRコードから、様々な分野やアプリケーションにおける Phenom ParticleXの自動化のアプローチをご覧ください。



ジャスコインタナショナル株式会社

• Web: www.jascoint.co.jp • E-mail: sales2@jascoint.co.jp

□ 東京サービスセンター

〒192-0046 東京都八王子市明神町1-11-10

TEL: 042-643-3201(代) FAX: 042-660-8046

□ 大阪サービスセンター

〒540-0028 大阪府大阪市中央区常盤町2-2-10 ブランクレール谷町205

TEL: 06-6940-0351(代) FAX: 06-6940-0352